

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы
С О Ю З А С С Р**

**МИКРОСХЕМЫ
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ**

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ**

ГОСТ 18683.0—83

(СТ СЭВ 1622—79, СТ СЭВ 3197—81),

ГОСТ 18683.1—83 (СТ СЭВ 3197—81),

ГОСТ 18683.2—83 (СТ СЭВ 3197—81)

Издание официальное

45 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ****ГОСТ**

18683.0—83

(СТ СЭВ 1622—79,
СТ СЭВ 3197—81)

Взамен

ГОСТ 18683—76

(в части разд. 1 и 2)

Общие требования при измерении
электрических параметровDigital integrated circuits.
General requirements for measuring
electrical parameters

ОКП 62 3100

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 апреля 1983 г. № 1688 срок введения установлен

с 01.01.84

Проверен в 1988 г. Постановлением Госстандарта СССР от 28.06.88 № 2432
срок действия продлен

до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на цифровые интегральные микросхемы (далее — микросхемы) и устанавливает общие требования при измерении электрических параметров микросхем.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1622—79 и СТ СЭВ 3197—81 в части общих требований при измерении электрических параметров микросхем (см. приложение).

1. УСЛОВИЯ И РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Условия измерения, в том числе температура окружающей среды или температура в заданной точке на корпусе (теплоотводе) микросхемы, должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях (далее — ТУ) на микросхемы конкретных типов.

1.2. Значения параметров электрических режимов на выводах микросхем (напряжений питания, напряжений или токов на вхо-

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1983
© Издательство стандартов, 1991
Переиздание с Изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР